

第 33 回分析電子顕微鏡討論会のお知らせ

主催：公益社団法人 日本顕微鏡学会 分析電子顕微鏡分科会

協賛：日本物理学会、応用物理学会、日本表面科学会、日本金属学会、日本鉄鋼協会、日本分析化学会、
日本セラミックス協会、日本材料学会、触媒学会、軽金属学会、日本熱処理技術協会（依頼中含む）

日 程：平成 29 年 9 月 5 日（火）、6 日（水）（分析展 JASIS2017（主催：日本分析機器工業会）と共催）

会 場：幕張メッセ 国際会議室（千葉市美浜区中瀬 2-1）

参加費（予稿集含む）：顕微鏡学会員及び協賛学会員（個人会員）6,000 円、非会員 7,000 円、
学生 無料（予稿集別途 1,500 円）

内 容：分析電子顕微鏡に関わるチュートリアルと研究トピックス（一般講演含む）について講演が行われます。チュートリアルでは、分析電顕の基軸となる EDS、EELS に加えて、信号解析に関する詳しい講演がなされます。初日のトピックスセッションでは、「電子線照射に弱い試料分析」に焦点をあてて、電子線照射の効果や最新の研究事例を紹介します。二日目は「電子線 vs X 線—どちらがすごい？」というトピックスセッションで、電子線と X 線を用いた構造・状態解析に関する先導的な研究が報告されます。なお本年度は二日目の午後全枠を一般講演セッションに設定し、分析電顕に関わる活発な討論の機会を設けます。一般講演に奮ってご参加ください。

詳細は <http://eels.kuicr.kyoto-u.ac.jp/bunseki2017/>（4 月以降開設）をご覧ください。

申込方法：上記 Web サイトからお申込み頂くか、或いは下記の参加登録票を Fax にて御送付下さい。

連絡先：〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄 京都大学 化学研究所 複合ナノ解析化学

治田充貴（分析電子顕微鏡討論会事務局）

Tel. 0774-38-3057/Fax. 0774-38-3055 E-mail: bunseki33@eels.kuicr.kyoto-u.ac.jp

締 切：一般講演申込締切 7 月 14 日（金）、同予稿締切 7 月 21 日（金）、事前参加登録締切 8 月 29 日（火）*

*当日の参加申込みも歓迎いたしますが、できるだけ事前登録にご協力下さい。

FAX 用参加登録票：

送信先 0774-38-3055（京大・治田宛）

ふりがな
お名前: _____
ご所属: _____
E-mail: _____
参加費区分（該当箇所に✓を付けてください）
<input type="checkbox"/> 日本顕微鏡学会員 ¥6,000-
<input type="checkbox"/> 協賛学協会員 ¥6,000-
（学協会名 _____）
<input type="checkbox"/> 一般 ¥7,000-
<input type="checkbox"/> 学生 無料（ <input type="checkbox"/> 予稿集が必要 ¥1,500-）
<input type="checkbox"/> 請求書要（宛名：所属、氏名、両方）

●左の枠内に必要事項を記入のうえ、上記の Fax 番号へご送信下さい。

●Fax による登録の場合、本紙を当日ご持参下さい。

●参加費は、8 月 29 日までに銀行振込でお支払い頂くか、当日受付にて拝領致します。

振込先：三菱東京 UFJ 銀行 秋葉原支店

普通預金 口座番号 1095052

公益社団法人 日本顕微鏡学会

●請求書が必要な方は「請求書要」に✓を付けて下さい。

●複数の方が参加される場合には、本紙をコピーしてお使い下さい。



または <http://eels.kuicr.kyoto-u.ac.jp/bunseki2017/> より登録をお願いします。

第 33 回分析電子顕微鏡討論会 プログラム

(2017 年 4 月 10 日現在)

最新のプログラムは <http://eels.kuicr.kyoto-u.ac.jp/bunseki2017/> よりご確認ください。

9 月 5 日(火) 10:00-16:45

1. チュートリアル (各 40 分)

- | | | |
|--------|--|---------------|
| 10:00- | Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDXS) for Analytical Electron Microscope | 奥西 栄治 (JEOL) |
| 10:40- | EELS の基礎と解釈 | 溝口 照康 (東京大学) |
| 11:20- | 情報統計処理による信号抽出法の基礎 | 武藤 俊介 (名古屋大学) |

— 昼休み —

2. トピックス 1 「電子線照射に弱い試料の分析」

- | | | |
|--------|---|---------------|
| 13:30- | TEM による電子照射効果の研究
— 一点欠陥導入によって誘起される相変態 (HVEM) から内殻励起によって誘起される固相反応 (10kVEM) まで — | 森 博太郎 (大阪大学) |
| 14:10- | 燃料電池ナノ材料の TEM 解析 | 上野 武夫 (山梨大学) |
| 14:40- | 規則性多孔質材料の高分解能電子顕微鏡法と電子線照射ダメージ | 阪本 康弘 (東北大学) |
| — 休憩 — | | |
| 15:20- | ナノ粒子触媒の環境 TEM 観察 | 吉田 秀人 (大阪大学) |
| 15:50- | 電子線ホログラフィーによる絶縁体の電子線照射効果の観察 | 赤瀬 善太郎 (東北大学) |
| 16:20- | 総合討論 | |

9 月 6 日(水) 10:00-16:50

1. トピックス 2 「電子線 vs X 線 — どっちがすごい?」 (各 30 分)

- | | | |
|--------|----------------------------------|--------------|
| 10:00- | 収束電子回折による局所構造・静電ポテンシャル分布解析 | 津田 健治 (東北大学) |
| 10:30- | 放射光 X 線回折による強誘電体の静的・時分割構造物性研究の進展 | 黒岩 芳弘 (広島大学) |
| 11:00- | 電子線を用いた局所状態分析と物質機能解析 | 寺内 正己 (東北大学) |
| 11:30- | 高輝度 X 線放射光で探る機能性物質の電子状態 | 木村 昭夫 (広島大学) |

— 昼休み(分析展 JASIS2017 の見学を含む) —

2. 一般講演 (各 15 分) 10 件程度

14:00-